

光谱学与光谱分析

连续谱X射线在ICT中的能谱硬化修正模型

彭光含¹, 杨学恒¹, 韩忠¹, 蒲兴成^{2, 3}

1. 重庆大学数理学院, 重庆 400044
2. 重庆邮电学院计算机学院, 重庆 4000653. 重庆大学自动化学院, 重庆 400044

收稿日期 2004-7-8 修回日期 2004-11-23 网络版发布日期 2005-11-26

摘要 X射线ICT中, 由于连续谱X射线源在穿过物质时, 能量较低的射线优先被吸收, 也即较高能量的X射线的衰减系数比较低能量的X射线的衰减系数小, 射线随透射厚度增大, 变得更易穿透, 也就是发生了能谱硬化现象。如不加修正, 必引起赝像。文中对能谱硬化现象进行实验和理论上的分析, 探讨了在均匀物质中, X射线的衰减系数与透射厚度的关系, 提出新的能谱硬化修正方法和严谨精确的能谱硬化修正模型。

关键词 [连续谱](#) [X射线](#) [ICT](#) [硬化修正模型](#)

分类号 [O434.1](#) [TP391](#)

DOI:

通讯作者:
彭光含

扩展功能

本文信息

▶ [Supporting info](#)

▶ [PDF\(935KB\)](#)

▶ [\[HTML全文\]\(0KB\)](#)

▶ [参考文献\[PDF\]](#)

▶ [参考文献](#)

服务与反馈

▶ [把本文推荐给朋友](#)

▶ [加入我的书架](#)

▶ [加入引用管理器](#)

▶ [引用本文](#)

▶ [Email Alert](#)

相关信息

▶ [本刊中 包含“连续谱”的 相关文章](#)

▶ 本文作者相关文章

· [彭光含](#)

· [杨学恒](#)

· [韩忠](#)

· [蒲兴成](#)

·